

В.М. Камінський, З.Д. Ковалюк, В.І. Іванов

Структура та фізичні властивості шаруватих кристалів $\text{In}_2\text{Se}_3\text{-Mn}$, InSe-Mn і InSe-Fe

Чернівецьке відділення Інституту проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича Національної академії наук України, вул. І. Вільде 5, м. Чернівці, 58001, Україна, e-mail: chimsp@ukrpost.ua

Проведені дослідження впливу магнітних домішок на властивості шаруватих кристалів In_2Se_3 та InSe . Показана можливість утворення твердого розчину заміщення в монокристалах $\text{In}_2\text{Se}_3\langle 1 \text{ мас. \% Mn} \rangle$, $\text{InSe}\langle 0,5 \text{ мас. \% Mn} \rangle$. Отримані температурні залежності електропровідності впоперек ($\sigma_{\perp C}$) та вздовж ($\sigma_{\parallel C}$) кристалографічної вісі C легованих кристалів в інтервалі 80 - 400 К. Розрахована величина енергетичного бар'єру між шарами ΔE_δ для $\text{In}_2\text{Se}_3\langle \text{Mn} \rangle$ та $\text{InSe}\langle \text{Mn} \rangle$. Підтверджено феромагнітні властивості кристалів $\text{InSe}\langle \text{Fe} \rangle$.

Ключові слова: шаруваті кристали, твердий розчин, електропровідність, феромагнетизм.

Стаття поступила до редакції 13.04.2014; прийнята до друку 15.12.2014.

Вступ

Напівпровідники In_2Se_3 , InSe володіють шаруватою структурою і можуть використовуватись для виготовлення детекторів іонізованого випромінювання, твердотільних електродів, фоточутливих гетероструктур та ін.

Відомо існування α -, β -, γ -модифікацій In_2Se_3 , фазовий перехід $\alpha \rightarrow \beta$ відбувається при температурі ~ 200 °C, $\beta \rightarrow \gamma \sim 650$ °C [1]. Згідно [1] $\alpha\text{-In}_2\text{Se}_3$ має гексагональну структуру з параметрами елементарної комірки $a = 4,0 \text{ \AA}$, $c = 19,24 \text{ \AA}$, тоді як в роботі [2] встановлено, що структура сполуки тригональна (просторова група R3mH) $a = 4,05 \text{ \AA}$, $c = 28,77 \text{ \AA}$. Електричні характеристики In_2Se_3 суттєво розрізняються, що пов'язано з технологією отримання кристалів [1, 3, 4]. Зокрема, в роботі [4] проведенні дослідження електричних властивостей монокристалів In_2Se_3 , легованих Cd, I, Cu, актуальність яких обумовлена отриманням кристалів із широким спектром фізичних властивостей, придатних для використання в оптоелектроніці.

Шаруватий характер кристалічної структури InSe зумовлює анізотропію фізичних властивостей даних матеріалів. В InSe у діапазоні низьких температур ($T < 120$ K) електронний газ має двохвимірний характер, а при $T < 50$ K виникають хвилі зарядової щільності [5]. Легування InSe атомами Mn чи Fe призводить до появи феромагнетизму [6, 7]. В попередніх роботах [8, 9] досліджено фазовий склад і структуру монокристалів $\text{In}_2\text{Se}_3\langle \text{Mn} \rangle$ (1 та 6 мас. % Mn), а також електричні властивості кристалів

$\text{In}_2\text{Se}_3\langle \text{Mn} \rangle$, $\text{InSe}\langle \text{Mn} \rangle$ з метою отримання матеріалів придатних для використання в спінtronоніці при кімнатній температурі.

У даній роботі приведені результати дослідження структури, електричних і частково магнітних властивостей монокристалів селенідів індію, легованих магнітними домішками Mn та Fe.

I. Експериментальна частина

Напівпровідникові монокристали In_2Se_3 , InSe вирощували в кварцових ампулах методом Бріджмена. Легування проводилося додаванням відповідного масового відсотка домішки при загрузці перед синтезом сполуки. Використовувалися наступні вихідні матеріали: In – 000, Se – ОСЧ 22-6, електролітичний Mn та Fe, очищений вакуумною дистиляцією. Контроль кристалічної структури вирощених кристалів проводився на установці ДРОН-3 в CuK_α – випромінюванні. Отримані дифрактограми оброблялися за допомогою програмного забезпечення LATTIK-KARTA.

Електричні характеристики кристалів досліджувалися в діапазоні температур 80 – 400 K на зразках розміром $11 \times 2,5 \times 0,75$ мм. Експерименти проводили для стандартної геометрії шести контактів із чистого індію при постійному струмі та магнітному полі. Електропровідність перпендикулярно до шарів $\sigma_{\parallel C}$ вимірювалася чотирьохзондовим методом із контактами, що розташовані на протилежних гранях зразків: два з них охоплювали майже всю поверхню сколу і

використовувалися як струмові, а два інших точкові контакти – як зондові.

II. Результати дослідження

2.1. Структура та електричні властивості кристалів $\text{In}_2\text{Se}_3\langle\text{Mn}\rangle$ та $\text{InSe}\langle\text{Mn}\rangle$

На рис. 1 приведена рентгенограма кристалу $\text{In}_2\text{Se}_3(1\% \text{ Mn})$ знята від поверхні сколу зливка. На рентгенограмі зареєстровані відбивання $00l$ ($l = 6, 9, 12, 15, 18$) монокристала $\text{In}_2\text{Se}_3\langle\text{Mn}\rangle$. Додатковий пік $2\theta = 26.5^\circ$ свідчить про наявність мікроключень фази Se. Вимірювані параметри елементарної комірки $a = 4.000 \pm 0.003$, $c = 28.330 \pm 0.009 \text{ \AA}$ трохи менше параметрів нелегованого In_2Se_3 [2], тому можна припустити утворення твердого розчину заміщення в $\text{In}_2\text{Se}_3\langle\text{Mn}\rangle$ внаслідок заміщення атомів In меншими атомами Mn (іх атомні радіуси 1,63 та 1,37 \AA відповідно [9]).

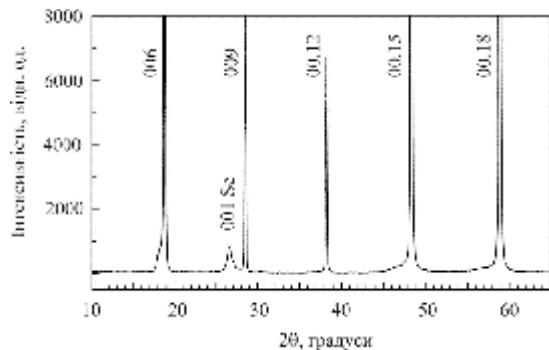


Рис. 1. Рентгенограма кристала $\text{In}_2\text{Se}_3(1\% \text{ Mn})$, CuK_α -випромінювання.

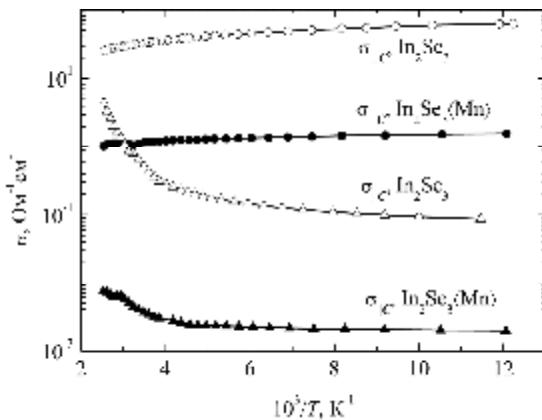


Рис. 2. Температурні залежності компонент електропровідності $\sigma_{||c}$ і $\sigma_{\perp c}$ кристалів In_2Se_3 і $\text{In}_2\text{Se}_3\langle\text{Mn}\rangle$.

Температурні залежності електропровідності вздовж ($\sigma_{||c}$) і перпендикулярно ($\sigma_{\perp c}$) кристалографічної осі C кристалів In_2Se_3 , $\text{In}_2\text{Se}_3\langle\text{Mn}\rangle$ приведені на рис. 2. Нелеговані зразки In_2Se_3 мали n -тип провідності з концентрацією вільних електронів $n = 4.9 \cdot 10^{17} \text{ см}^{-3}$ і холлівською електронною рухливістю вздовж шарів $\mu_{\perp c} = 405 \text{ см}^2/(\text{В}\cdot\text{с})$ при кімнатній температурі. Залежності $\sigma_{||c}(T)$, $\sigma_{\perp c}(T)$ $\text{In}_2\text{Se}_3\langle\text{Mn}\rangle$ мають відповідно напівпровідниковий і

металевий характер, що обумовлено відмінністю механізмів протікання струму в різних кристалографічних напрямах. Напівпровідниковий хід $\sigma_{||c}$ пов'язаний з ростом концентрації вільних електронів n , тоді як металевий характер $\sigma_{\perp c}$ викликаний переважаючим падінням рухливості $\mu_{\perp c}(T)$ над ростом n . Зменшення величини $\sigma_{||c}$ і $\sigma_{\perp c}$ $\text{In}_2\text{Se}_3\langle\text{Mn}\rangle$ (в порівнянні з In_2Se_3) в усьому температурному діапазоні пояснюється падінням рухливості внаслідок розсіювання носіїв заряду на просторових неоднорідностях кристалічної гратки, що виникли при утворенні твердого розчину заміщення і мікроключень фази Se.

На основі приведених на рис. 2 даних отримані температурні залежності анізотропії електропровідності кристалів $\text{In}_2\text{Se}_3\langle\text{Mn}\rangle$, з яких видно збільшення $\sigma_{\perp c}/\sigma_{||c}$ при пониженні температури в усьому діапазоні температур [8]. Отримані значення $\sigma_{\perp c}/\sigma_{||c}$ складали ~800 і 200 при температурах 80 і 300 K, відповідно.

Високі значення анізотропії електропровідності в шаруватих кристалах обумовлені специфікою енергетичних зон [10], а також впливом структурних дефектів на процес електропереносу в кристалі. Наявність слабкого Ван-дер-Ваальсівського зв'язку між шарами сприяє локалізації домішкових атомів в октаедрических і тетраедрах пустотах міжшарового простору, а також утворенню дефектів упаковки. Площинні структурні дефекти утворюють додаткові енергетичні бар'єри ΔE_δ при русі носіїв заряду вздовж кристалографічної осі C . В цьому випадку згідно [11] величину анізотропії можна записати як $\sigma_{\perp c}/\sigma_{||c} \approx \exp(\Delta E_\delta/kT)$. Для визначення величини бар'єру температурні залежності анізотропії електропровідності побудовані в координатах Ареніуса $\ln(\sigma_{\perp c}/\sigma_{||c})$ від $10^3/T$. З їх нахилу в низькотемпературній області знайдено, що ΔE_δ складало 5,5 для кристалів $\text{In}_2\text{Se}_3\langle\text{Mn}\rangle$.

Нелеговані кристали InSe мали n -тип провідності, концентрація вільних електронів складала $n = 10^{15} \text{ см}^{-3}$, холлівська рухливість носіїв заряду $\mu_{\perp c} = 850 \text{ см}^2/(\text{В}\cdot\text{с})$ при $T = 300 \text{ K}$. Методом Вайсенберга встановлено, що монокристали InSe мають ромбоедричну структуру γ -політіпу (пр. гр. C_{3v}^5), вимірювані періоди гратки $a = 4.003 \pm 0.001 \text{ \AA}$, $c = 24.9553 \pm 0.0006 \text{ \AA}$ (в гексагональних осіях).

Температурні залежності $\sigma_{||c}$ і $\sigma_{\perp c}$ для $\text{InSe}\langle\text{Mn}\rangle$ (рис. 3) показали їх напівпровідниковий характер, тоді як в нелегованому InSe $\sigma_{||c}$ має металевий характер. Вимірювані значення анізотропії електропровідності в $\text{InSe}\langle\text{Mn}\rangle$ значно менше ніж в InSe. З температурної залежності $\sigma_{\perp c}/\sigma_{||c}$ розрахована величина енергетичного бар'єру між шарами $\Delta E_\delta = 2.84 \text{ мeV}$ в низькотемпературній області $\text{InSe}\langle\text{Mn}\rangle$.

З вимірювань коефіцієнта Холла встановлено зміну типу провідності з підвищеннем температури з p на n при $T \approx 240 \text{ K}$. Вимірювані значення концентрації дірок p при $T = 100 \text{ K}$ складали $3.56 \cdot 10^{13} \text{ см}^{-3}$, а електронів – $7.4 \cdot 10^{14} \text{ см}^{-3}$ при $T = 350 \text{ K}$.

Можна припустити що легування марганцем призводить до появи акцепторних рівнів в

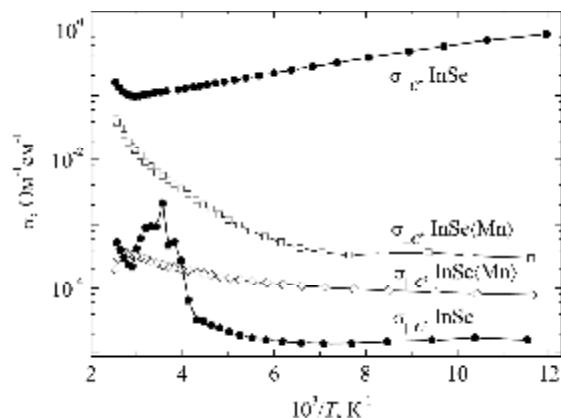


Рис. 3. Температурні залежності компонент електропровідності $\sigma_{||c}$ і $\sigma_{\perp c}$ кристалів InSe, InSe<0.5 % Mn>.

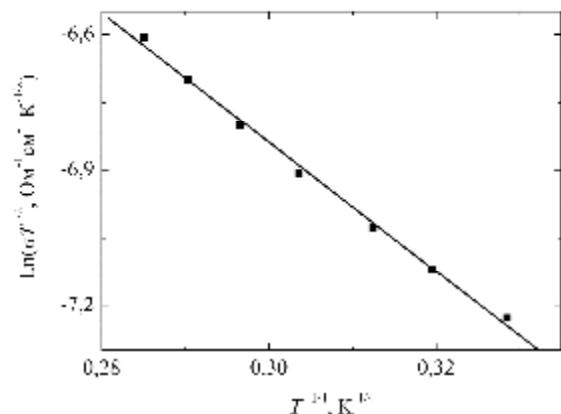


Рис. 4. Температурна залежність провідності $\sigma_{||c}$ для InSe<Mn> в координатах Мотта.

забороненій зоні InSe<Mn>. Збільшення $\sigma_{\perp c}$ і $\sigma_{||c}$ з ростом температури в низькотемпературній p -області обумовлено активацією акцепторних, а у високотемпературній n -області – донорних рівнів.

У шаруватих кристалах внаслідок наявності

структурних дефектів має місце стрибковий механізм провідності [12-14]. Зокрема, в роботові [13] показано, що в кристалах InSe провідність вздовж шарів обумовлена протяжними станами зони провідності, а впоперек шарів (при $T < 120$ K) має місце стрибкова провідність по станах, локалізованих біля рівня Фермі.

Для з'ясування механізму протікання струму в кристалах InSe<Mn> побудовано температурну залежність електропровідності $\sigma_{||c}$ в координатах Мотта (рис. 4). Експериментальні точки кривої в області 150 - 80 K добре спрямлюються в координатах Мотта $\ln(\sigma T^{1/2}) - T^{-1/4}$, що підтверджує наявність стрибкового механізму переносу носіїв заряду. Розраховані параметри стрибкової провідності згідно робіт [13, 15] наступні: густина станів $N_F = 4,7 \cdot 10^{19}$ эВ⁻¹см⁻³, довжина стрибка $R = 81,74$ Å (при $T = 115$ K), розкид енергій поблизу рівня Фермі $\Delta E = 0,0186$ еВ. Для розрахунків використовувалися наступні параметри: $T_0 = 4,2 \cdot 10^4$ K, величина борівського радіусу екситону в InSe $a_0 \sim 50$ Å, $\beta = 21$.

Відмітимо також, що експериментальні залежності $\sigma_{||c}(T)$ досліджуваних кристалів In₂Se₃, In₂Se₃<Mn> в діапазоні температур 130 - 80 K також лінійні в координатах Мотта.

2.2. Особливості фізичних властивостей кристалів InSe, легованих Fe.

Дослідження кристалічної структури InSe<1 мас. % Fe> проводили методом порошків. На рис. 5 приведена рентгенограма порошку InSe<Fe> (CuK_α-випромінювання), з якої видно, що вирощені кристали мають структуру ромбоедричної сингонії вихідного γ-InSe.

Прецізійні вимірювання періоду гратки c InSe<Fe> проводили методом Бонда в CuK_α-випромінюванні, відбивання 00.27. Отримані значення параметра гратки c з двох зразків InSe<Fe> складали $c_1 = 24,9503$, $c_2 = 24,945 (\pm 0,0015)$ Å ($c_{InSe} = 24,9553$ Å). Відмінність отриманих значень c_1 і c_2

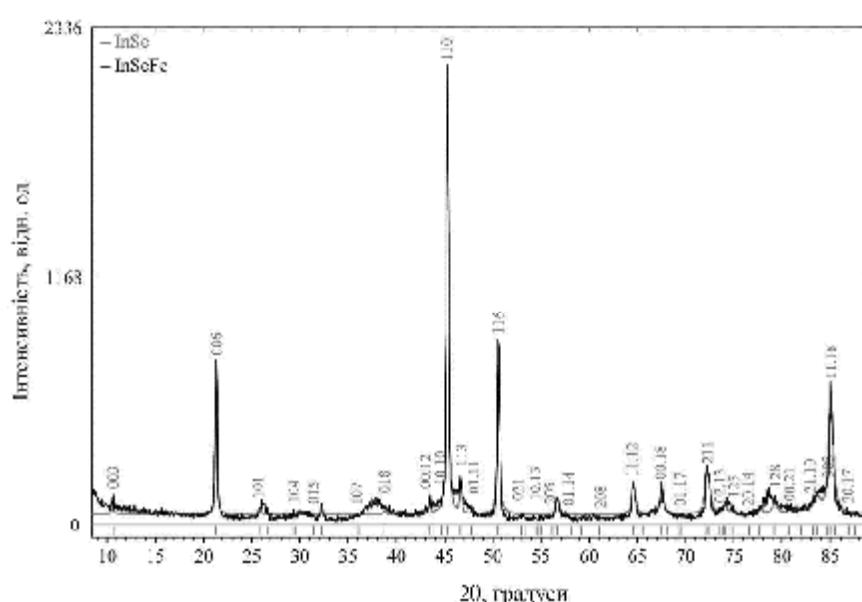


Рис. 5. Рентгенограма кристалів InSe<Fe>.

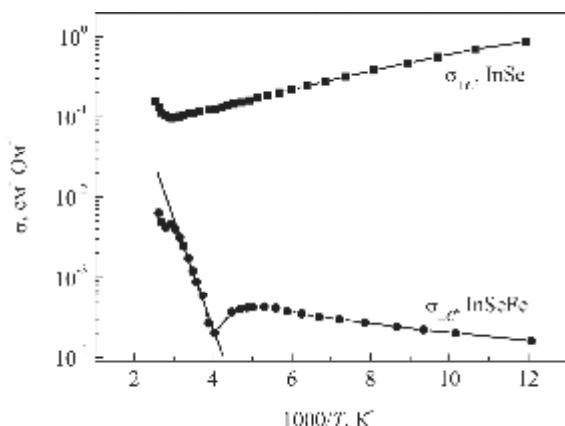


Рис. 6. Температурні залежності електропровідності $\sigma_{\perp c}$ кристалів InSe і InSe(Fe).

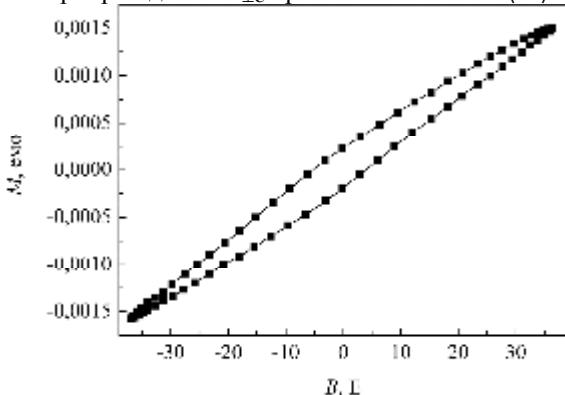


Рис. 7. Петля гістерезису в $\text{In}_{1-x}\text{Fe}_x\text{Se}$ ($x=0.005$) при 200 К.

пов'язаної з нерівномірним розподілом домішки Fe вздовж зливка.

Оскільки вимірювані періоди гратки InSe і InSe(Fe) мають близькі значення, а атомні радіуси Fe і In значно відрізняються ($r_{\text{Fe}} = 1,26$, $r_{\text{In}} = 1,66$ Å), то можна припустити, що атоми Fe можуть заміщати атоми In у внутрішньошаровому просторі InSe (відстань In-In складає 2,88 Å), а також розташовуватися в октаедричних пустотах міжшарового простору.

Вирощені кристали InSe(Fe) мали n -тип провідність, концентрація вільних електронів $n = 10^{14} \text{ см}^{-3}$, їх рухливість $\mu = 150 \text{ см}^2/(\text{В} \cdot \text{с})$ при $T = 300$ К. Температурна залежність електропровідності $\sigma_{\perp c}(T)$ кристалів InSe, InSe(Fe) приведена на рис. 6. Хід кривої для InSe(Fe) має напівпровідниковий характер, а InSe – металевий. Зменшення електропровідності $\sigma_{\perp c}$ InSe(Fe) в порівнянні з InSe обумовлене низькими значеннями концентрації вільних носіїв заряду n і рухливості $\mu_{\perp c}$, внаслідок неоднорідності кристалічної структури.

Зростання електропровідності в низькотемпературній області InSe(Fe) визначається ростом концентрації носіїв заряду за рахунок активації мілких донорних рівнів. В процесі росту температури всі домішки в кристалі стають іонізованими і спад електропровідності при $T = 250$ К обумовлений зменшенням рухливості електронів з ростом температури. На основі температурної

залежності концентрації вільних електронів $n = n_0 e^{-\Delta E/kT}$ визначена енергія активації $\Delta E = 0,046$ еВ мілких донорних рівнів кристалів InSe(Fe). Збільшення електропровідності $\sigma_{\perp c}$ InSe(Fe) в області $T > 250$ К пов'язане із значним ростом n за рахунок іонізації глибоких донорних рівнів, для яких розрахована енергія активації складала 0,29 еВ.

Експериментальне значення анізотропії електропровідності $N = \sigma_{\perp c}/\sigma_{\parallel c}$ кристалів InSe(Fe) рівне 124 при 300 К, що значно нижче чим в InSe і визначається низькими значеннями $\sigma_{\perp c}$.

З проведених досліджень магнітних властивостей InSe(Mn) встановлена феромагнітна обмінна взаємодія між іонами Mn в діапазоні низьких температур 140 - 300 К [6], а для кристалів InSe_{0,9}Fe_{0,1} в роботі [7] визначені значення коерцитивної сили $H_c = 66,02$ Е і залишкового намагнічування $M_r = 0,07$ емо/г Особливістю феромагнетизму в напівпровідниках можна відмітити низькі значення температури Кюрі, а також наявність мінімуму на кривій електропровідності $\sigma(T)$ в області точки Кюрі для невироджених напівпровідників з низькою концентрацією донорів [16].

На рис. 7 приведена крива намагнічування $M(H)$ в області слабких магнітних полів $H = \pm 40$ Е при $T = 200$ К. На підставі появи петлі гістерезису можна припустити існування трьохвимірного феромагнітного впорядкування в локальних областях кристалів InSe(Fe) (клasterна модель феромагнетизму). Вимірювані значення коерцитивної сили $H_c = 5$ Е. Феромагнітні властивості напівпровідника залежать від відстані між іонами Fe, локалізованими в кристалічній гратці InSe(Fe), оскільки згідно з критерієм феромагнетизму для переходів металів додатні значення обмінного інтеграла A визначаються величиною V , де V дорівнює відношенню параметра гратки феромагнітних елементів до діаметру незаповненої d -оболонки [17]. Феромагнітні напівпровідники InSe(Mn), InSe(Fe) з низьким значенням коерцитивної сили і залишкової намагніченості можуть використовуватися для виготовлення оптоелектронних и фотогальванічних пристроїв [7].

Висновки

З рентгенівських досліджень показано утворення твердого розчину заміщення в монокристалах InSe(1,5 % Mn), In₂Se₃(1 % Mn).

Отримано температурні залежності компонент електропровідності $\sigma_{\parallel c}$, $\sigma_{\perp c}$ In₂Se₃(Mn), які мають відповідно напівпровідниковий і металевий характер. Температурні залежності $\sigma_{\parallel c}$ і $\sigma_{\perp c}$ для InSe(Mn) показали їх напівпровідниковий характер, тоді як в нелегованому InSe $\sigma_{\perp c}$ має металевий характер. У діапазоні температур 150–80 К має місце стрибковий механізм провідності вздовж кристалографічної осі C InSe(Mn).

Високі значення анізотропії електропровідності $\sigma_{\perp c}/\sigma_{\parallel c}$ зумовлені наявністю структурних дефектів,

локалізованих в міжшаровому просторі шаруватих кристалів. Величина енергетичного бар'єру між шарами ΔE_δ , розрахована з експериментальних залежностей $\sigma_{\perp C}/\sigma_{||C}(T)$ в низькотемпературній області рівна 5,5 і 2,84 мeВ для кристалів $In_2Se_3\langle Mn \rangle$ і $InSe\langle Mn \rangle$ відповідно.

Зростання електропровідності в

низькотемпературній області $InSe\langle Fe \rangle$ визначається ростом концентрації вільних носіїв заряду за рахунок активації мілких донорних рівнів $\Delta E = 0,05$ еВ, у високотемпературній – глибоких донорних рівнів $\Delta E = 0,29$ еВ. В області $T = 200$ К встановлена слабка феромагнітна взаємодія між іонами Fe в $InSe\langle Fe \rangle$.

- [1] Z.S. Medvedeva, Hal'kogenidy jelementov III. B podgruppy periodicheskoy sistemy. (Nauka, Moskva, 1968).
- [2] K. Osamura, Y. Murakami, and Y. Tomiie, Phys. Soc. Jpn. 21, 1848 (1966).
- [3] G. Micocci, A. Tepore, R. Rella, P. Siciliano, Phys. Status Solidi a 126(2), 437 (1991).
- [4] A.V. Zaslonkin, Z.D. Kovaljuk, I.V. Mintjanskij, Neorg. Mat. 43(12), 1415 (2007).
- [5] A.I. Dmitriev, Z.D. Kovakyuk, V.I. Lazorenko, and G.V. Lashkarev, Phys Stat Sol b 162 (1), 213 (1990).
- [6] V.V. Slyn'ko, A.G. Khandozhko, Z.D. Kovalyuk et al., Phys. Rev. B 71(24), 245301 (2005).
- [7] Karimat El-Sayed, Z.K. Heibaa, K. Sedeekc, H.H. Hantourc. Magnetic, Journal of Alloys and Compounds, 530, 102 (2012).
- [8] V.M. Kaminskii, Z.D. Kovalyuk, A.V. Zaslonkin, and V.I. Ivanov, Semiconductor Physics, Quantum Electronics and Optoelectronics, 12(3), 290 (2009).
- [9] V.M. Kaminskij, Z.D. Kovaljuk, A.V. Zaslonkin, V.I. Ivanov, Neorg. mat., 48(2), 144 (2012).
- [10] M.I. Brodin, I.V. Blonskij, Jeksitonnye processy v sloistyh kristallah (Nauk. dumka, Kiev, 1986).
- [11] R.S. Fivas, Nuovo. Cim. 63B (1), 10 (1969).
- [12] S.N. Mustafev, FTT 46(6), 979 (2004).
- [13] G.L. Belen'kij, N.A. Abdullaev, V.N. Zverev, V.Ja. Shtejnshrajber, Pis'ma v ZhJeTF 47(10), 498 (1988).
- [14] A.F. Qasrawi, I. Gunal, C. Ercelebi, Crys. Res. Technol. 35(9), 1077 (2000).
- [15] V.T. Avanesjan, S.A. Potachev, E.P. Baranova, FTP 43(11), 1538 (2009).
- [16] Je.L. Nagaev, Fizika magnitnyh poluprovodnikov (Nauka, Moskva, 1979).
- [17] E.S Borovik, V.V.Eremenko, A.S. Mil'ner, Lekcii po magnetizmu (Fizmatlit, Moskva, 2005).

V.M. Kaminskii, Z.D. Kovalyuk and V.I. Ivanov

Structure and Physical Properties of $In_2Se_3\langle Mn \rangle$, $InSe\langle Mn \rangle$ and $InSe\langle Fe \rangle$ Layered Crystals

I.M. Frantsevich Institute for Problems of Materials Science of the National Academy of Sciences of Ukraine, Chernivtsi Department 5, Iryna Vilde St., 58001 Chernivtsi, Ukraine, e-mail: chimsp@ukrpost.ua

The influence of magnetic impurities on the properties of In_2Se_3 and $InSe$ layered crystals was studied. The results indicate the formation of substitutional solid solutions in the $In_2Se_3\langle 1 \text{ wt. \% Mn} \rangle$, $InSe\langle 0.5 \text{ wt. \% Mn} \rangle$ single crystals. Temperature dependences of electroconductivity across ($\sigma_{\perp C}$) and along ($\sigma_{||C}$) the C crystallographic axis of doped crystals were measured in the range of 80–400 K. The values of energy barrier height between the crystal layers ΔE_δ were evaluated for $In_2Se_3\langle Mn \rangle$ and $InSe\langle Mn \rangle$. It was established that $InSe\langle Fe \rangle$ crystals exhibit ferromagnetic properties.

Keywords: layered crystals, solid solution, electroconductivity, ferromagnetics.